

SEMICON Japan 出展のお知らせ

名 称 : SEMICON Japan

会 期 : 2017年12月13日(水)~15日(金) 10:00~17:00

会 場 : 東京ビッグサイト (東京都江東区有明3-11-1)

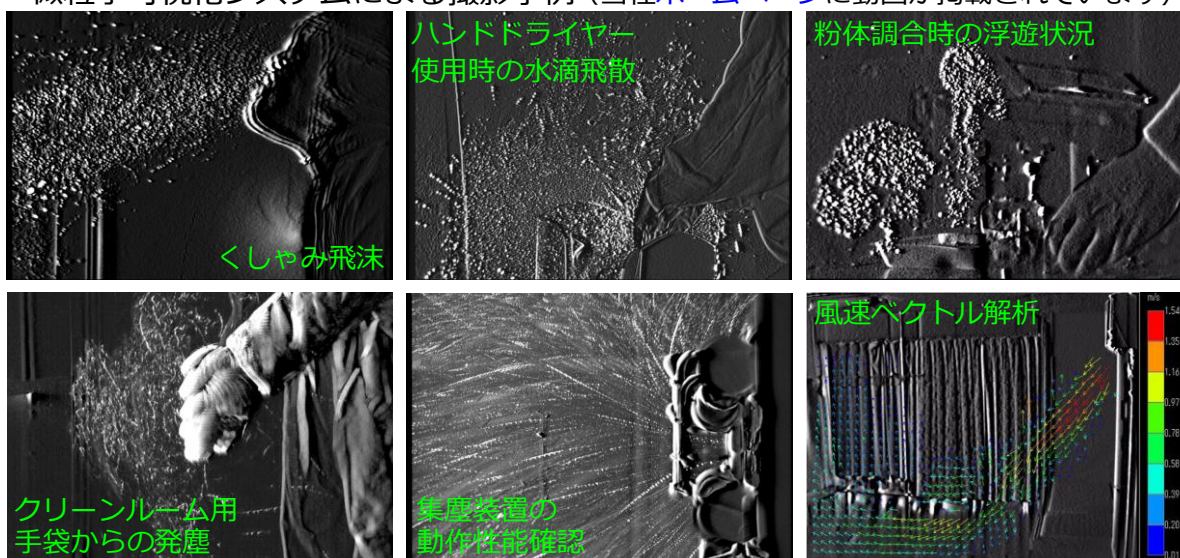
出展場所 : 東5ホール No. 5525

U R L : <http://www.semiconjapan.org/> ※URL先より事前入場登録[無料]をすることができます

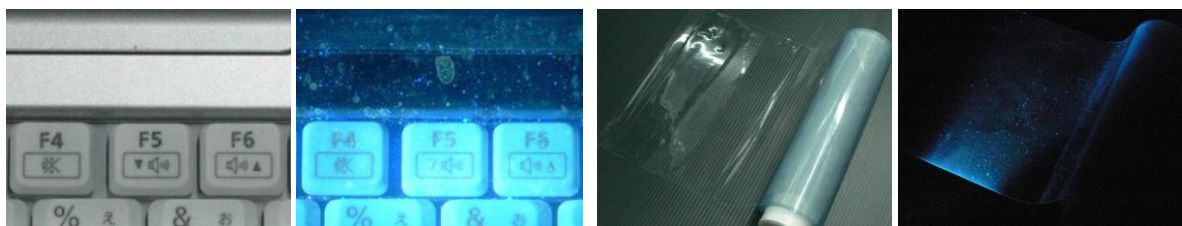
SEMICON®
JAPAN

～ 世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します ～

微粒子可視化システムによる撮影事例 (当社ホームページに動画が掲載されています)



表面に付着した異物を識別観察する、これまでにないタイプの可視化ツールもあります



キーボード表面の異物

フィルム表面の異物

自社ブランド「ViEST®」として展開している当社の微粒子可視化技術は、80ナノメートルの浮遊粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の撮影感度をもった可視化技術です。国内外で、可視化システムの販売や、システムを利用した受託評価サービス(生産工程や製造装置内外における微粒子や気流の挙動調査、各種設備性能の評価など)を展開しています。

本展では、可視化システムや撮影事例動画を展示し、微粒子可視化のデモンストレーションも実施いたします。また、発売開始以来さまざまな業界から高い評価をいただいている付着異物識別ツールのほか、今年度販売を開始した新商品もすべて展示します。当社の高感度な微粒子可視化技術を是非会場でご体感ください。

<本件に関する問い合わせ先>

ビジュアルソリューション事業部 Tel: 03-3639-2206 E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～